

The Ion Beam Induced Charge (IBIC) technique to characterize semiconductor detectors using low energy particle accelerator

lunes, 28 de noviembre de 2016 17:50 (20)

Summary

Presenter(s) : Dr. GARCIA LOPEZ, Javier (Dept. Atomic, Molecular and Nuclear Physics and National Accelerator Center. University of Sevilla. Spain)

Clasificación de la sesión : Investigación orientada, tecnología e innovación